3B07 内部時却ダイナミクス計》

内殻励起ダイナミクス計測から探る有機単分子膜の高速電荷移動 (広大院・理¹,広大・放射光センター²) 〇和田真一^{1,2},古賀亮介¹,林下弘憲¹,小川舞¹,梶川隼平¹,平谷篤也^{1,2}

Ultrafast charge transfer of organic monolayers probed by core-excitation dynamics measurements

(¹Graduate School of Science, ²HSRC, Hiroshima Univ.) OS. Wada^{1,2}, R. Koga¹, H. Hayashita¹, M. Ogawa¹, J. Kajikawa¹, A. Hiraya^{1,2}

【序】 有機界面における電荷移動のナノレベルでの理解は、有機分子デバイスを基盤とした応用研究において重要である。我々は内殻電子励起による反応ダイナミクス計測という、従来の計測手法とは異なる非接触な手法で、有機単分子の高速電荷移動計測を試みたいと考えている。

本研究で着目する軟X線を用いた内殻励起の最大の特徴は、価電子励起とは異なる局所的な電 子遷移であり、分子内の特定の原子を選択的に励起することができる点にある。そのためオージェ崩 壊後のイオン性解離を経ることで、選択的な化学結合の切断が可能になる。我々は、内殻共鳴励起 によるサイト選択的化学結合切断が、反応場となる末端官能基を最表面に規則正しく配列した自己 組織化単分子膜(SAM)において顕著に観測されることを見出すとともに、その選択性が周辺分子 環境に依存した電荷およびエネルギーの失活のしやすさに大きく影響されることを見出した[1]。一 方、オージェ崩壊過程も電荷移動の起こりやすさによって影響を受ける。内殻電子を非占有軌道に 共鳴励起すると、オージェ崩壊によって通常は共鳴オージェ電子が放出される。もし、この励起電子 が基板と強く相互作用して内殻正孔寿命よりも速く基板に失活するような場合は、結果的には内殻

電子を直接イオン化したことと同じになるため、 正常オージェ電子が放出されることになる。し たがって共鳴オージェ/正常オージェ収量比 を計測することで、このような速い電子移動ダ イナミクスを、内殻正孔寿命(酸素の場合で 4 fs)を基準とする速度として決定することができ る(core-hole clock (CHC)法)[2,3]。

本研究では、選択的イオン脱離反応が顕著 に起きる種々の SAM を対象試料に、構成分 子中の反応部位から金属基板へ非局在化す る電子の高速移動をCHC法で計測し、選択的 結合切断反応における選択性の違いとの関係 性をもとに議論した。

【実験】本研究では末端をメチルエステル修飾した種々のSAMを用いた(図2)。実験は、高エネルギー加速器研究機構PFのBL-7Aおよび広島大学放射光科学研究センター HiSOR BL13の放射光光源を用いて行った。 全電子収量および全イオン収量から内殻励起



選択的イオン脱離

基板への電荷移動

図1.メチルエステル修飾SAMでの内殻共鳴励起に よるサイト選択的イオン脱離と励起電子の電荷移動 の概念図。(左)観測されているサイト選択的イオン脱 離反応の例。O-CH3結合の選択的切断によるCH3⁺イ オンとC-OCH3結合切断によるOCH⁺イオンの検出。 (右)共鳴オージェ電子分光で議論できる内殻共鳴励 起電子の高速失活。観測される電子移動は内殻正 孔寿命(酸素 1s では4 fs)と競争する程度の速さ。

スペクトルの帰属を行い、PF のシングルバンチ運転を利用した 飛行時間型イオン質量測定により各脱離イオンの収量スペクト ルを得た。また HiSOR で共鳴オージェスペクトルを計測し、 Spectator(傍観)型オージェ成分比の変化から電子移動ダイナミ クスについて考察した。

【結果と考察】 C1s→ σ *(O-CH₃) 共鳴励起で CH_n+イオン (n=0-3)が選択的に脱離する。各 SAM におけるこの CH_n+イオン 収量比(フラグメンテーション比)を図3に示す。絶縁性が高い脂 肪鎖 SAM MHDA に比べて、導電性が高い芳香鎖 SAM の方

がフラグメンテーションを激しく起こして脱離 していることが分かる。内殻共鳴励起により 選択的に解離する比較的速い過程と、付随 するエネルギーの散逸による非選択的な間 接解離過程によってイオンの脱離が引き起こ されており[1]、両者のバランスによってフラグ メンテーションパターンが決まっていると考え られる。すなわち、導電性が高い芳香鎖 SAM では、後者の比較的遅い間接過程が 基板への速い電子失活によって抑制された と考えられる。これは分子鎖長にしたがって M2P, MP1, MP0の順にフラグメンテーション が激しくなっていることからも分かる。

そこで電荷移動ダイナミクスの違い を具体的に評価するため、2 つの芳 香鎖SAMで共鳴オージェ電子スペク トルを測定した。図4は傍観型成分の みを抽出し、全オージェ収量との比と してプロットしたものである。図が示す 傍観型成分の失活度合いから、いず れの芳香鎖SAMも内殻正孔寿命より も速い速度で電子移動失活を起こし ており、鎖がより短い MPO の方がより 速く失活していることが分かる。このよ うに内殻励起反応ダイナミクス計測法 を用いることで、有機単分子の電荷移 動を非接触に計測し議論することが できると考えられる。

【引用文献】[1] S. Wada et al., J. Phys: Condens. Matter 18, S1629 (2006). [2] J. Schnadt et al., Nature 418, 620 (2002). [3] A. Fohlisch et al., Nature 436, 373 (2005).

図 2. 本研究で用いたメチルエ ステル修飾 SAM。



図 3. Cls→σ*(O-CH₃)励起で選択的に脱離した CH_n⁺イオンの収量比。



図 4. MP0 および M2P SAM での酸素領域における傍観型 共鳴オージェ成分比。

